

Состояние разработки микроскопа на длину волны 3.37 нм в ИФМ РАН <i>И. В. Малышев, А. Е. Пестов, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало</i>	3
Комплект многослойных рентгеновских зеркал для двухзеркального монокроматора в диапазоне длин волн 0.41–15.5 нм <i>А. А. Ахсаханян, Ю. А. Вайнер, С. А. Гарахин, К. А. Елина, П. С. Заверткин, С. Ю. Зуев, Д. В. Ивлюшкин, А. Н. Нечай, А. Д. Николенко, Д. Е. Парьев, Р. С. Плешков, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, М. В. Свечников, Н. И. Чхало</i>	14
Микроструктура и плотность пленок Мо в многослойных зеркалах Мо/Si <i>Ю. А. Вайнер, С. А. Гарахин, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, М. В. Свечников, Н. И. Чхало, П. А. Юнин</i>	21
Атомно-масштабные исследования адсорбции молекул фторфуллеренов на поверхности твердых тел <i>Р. З. Бахтизин, А. И. Орешкин, Д. А. Музыченко, С. И. Орешкин, В. А. Яковлев</i>	28
Наблюдение квантоворазмерных эффектов при исследовании резистивного переключения в диэлектрических пленках с наночастицами Au методом туннельной атомно-силовой микроскопии <i>Д. О. Филатов, И. А. Казанцева, Д. А. Антонов, И. Н. Антонов, М. Е. Шенина, О. Н. Горшков</i>	38
Изучение процессов локальной аккумуляции заряда в пленках $ZrO_2(Y)$ с наночастицами Au методом кельвин-зонд-микроскопии <i>М. Н. Коряжкина, Д. О. Филатов, И. Н. Антонов, М. А. Рябова, М. С. Дунаевский</i>	45
Исследование влияния оптического излучения на резистивное переключение в пленках $ZrO_2(Y)$ с наночастицами Au методом туннельной атомно-силовой микроскопии <i>А. С. Новиков, Д. О. Филатов, Д. А. Антонов, И. Н. Антонов, М. Е. Шенина, О. Н. Горшков</i>	52
Атомно-силовая микроскопия в исследовании трибологических характеристик тонких покрытий Al–Si–N <i>Т. А. Кузнецова, Т. И. Зубарь, В. А. Лапицкая, К. А. Судилова, С. А. Чижик, В. В. Углов, В. И. Шиманский, Н. Т. Квасов</i>	59
Блеск многослойных дифракционных решеток в МР-диапазоне — дизайн роста с учетом деформации профиля штрихов <i>Л. И. Горай, М. Н. Лубов</i>	65
Исследование влияния облучения ионами на механические свойства стали Eurofer 97 <i>Е. В. Гладких, К. С. Кравчук, А. С. Усеинов, А. А. Никитин, С. В. Рогожкин</i>	73
Определение модуля Юнга вюрцитных нанопроводов $A^{III}B^V$ методами сканирующей зондовой микроскопии <i>М. С. Дунаевский, П. А. Алексеев, P. Geydt, E. Lahderanta, T. Haggren, H. Lipsanen</i>	79
Синтез и свойства наноразмерных пленок BiG для гетероструктур магнитоплазмоники <i>П. Н. Найденов, О. Л. Голикова, В. А. Кецко, А. Л. Чехов, Т. В. Мурзина</i>	83
Деградация оптических свойств микро- и нанопорошков оксида цинка при облучении протонами и электронами <i>В. В. Нежищенко, Ли Чундун, М. М. Михайлов</i>	88
Воздействие импульсов ударных волн на структуру и сверхпроводящие параметры лент MgB_2 <i>Б. П. Михайлов, В. Я. Никулин, А. Б. Михайлова, П. В. Силин, И. В. Боровицкая, С. В. Шавкин, А. А. Серов</i>	92
Идентификация диффузионной длины в нитриде галлия катодолюминесцентным методом в случаях экситонной рекомбинации и примесной рекомбинации неравновесных носителей заряда <i>Н. Н. Михеев, Н. А. Никифорова, М. А. Степович</i>	98
МД-моделирование физического распыления пористых Si-содержащих материалов ионами Ag низких энергий <i>А. А. Сычева, Е. Н. Воронина, Т. В. Рахимова</i>	104